

VLSI测试方法学和可测性设计



[VLSI测试方法学和可测性设计_下载链接1](#)

著者:雷绍充

出版者:电子工业出版社

出版时间:2005-1-1

装帧:平装(无盘)

isbn:9787121003790

作者介绍:

目录:

[VLSI测试方法学和可测性设计_下载链接1](#)

标签

评论

[VLSI测试方法学和可测性设计_下载链接1](#)

书评

[VLSI测试方法学和可测性设计_下载链接1](#)